

JS-M100-HVF 高電圧テスター



高電圧テスターは、基板の状態で個々の素子に過電圧を印加し、異常素子をレーザーで断線させます

HIPA 高電圧テスターの特徴

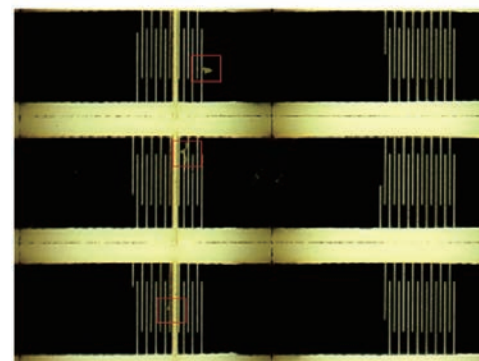
HIPA 高電圧テスターは、抵抗体に短時間の過負荷を印加し、欠陥が内在した素子を破壊（抵抗値変化）させます。電圧印加前後で抵抗値を測定する機能を備えており、電圧印加により抵抗値変化した素子はレーザーにより切断（断線）します。この機能により不安定要素を内在する素子をリジェクトすることが可能となります。

HIPA 高電圧テスターは、HIPA レーザートリミングシステムの技術をベースに作られた薄膜抵抗器、高精度厚膜抵抗器などに有用なシステムです。

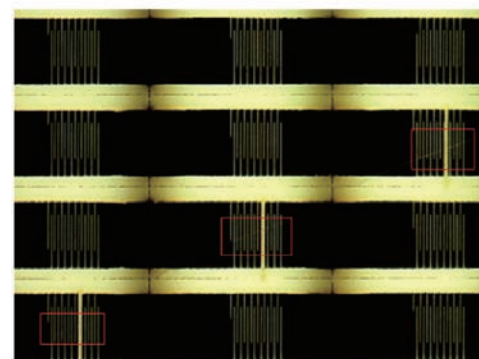
- * 独自の自社開発測定システム及び制御システムを搭載、高精度な測定と制御を可能にしています
- * 自社製ファイバーレーザーを搭載し優れた機能とコストパフォーマンスを提供します
- * 1Ω～1MΩまでの抵抗値範囲に対応します
- * 自社開発のソフトウェアシステムで操作は簡単で必要な処理が可能です
- * 測定およびレーザー切断機能を外した電圧印加専用機もあります

仕様

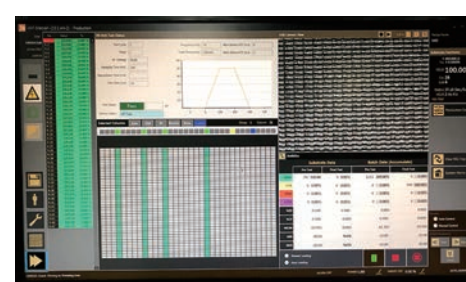
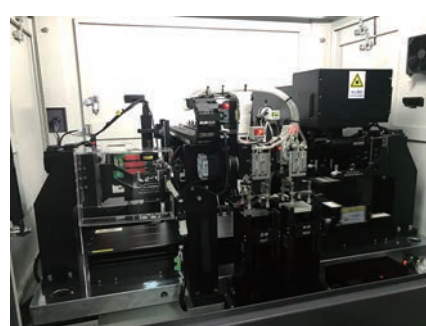
型番	JS-M100-HVF
適応素子サイズ	1005mm以上 (0402inch以上)
抵抗値設定範囲	1Ω — 1MΩ
最大電圧値	600 V
高圧保護	過電流フェーズアラーム
レーザー出力	20W / 30W
ビームエキスパンダ	2 倍
フォーカス距離	125 mm
ガルバノメーター位置精度	± 1 μm
テーブル搬送位置精度	1 μm
テーブルクランプ繰返し精度	5 μm以内
測定チャンネル	192
プローブカード固定	水平調節可能



不良チップ抵抗



損傷チップ抵抗



仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。